

26. 基本技術分野における 国際標準化アクションプラン

1. 分野の全体概要・最近の動向

(1) 基本技術分野の全体概要

基本技術分野の対象としている国際標準化活動は、TC10（製図）、TC12（量・単位記号）、TC37（用語）、TC43（音響）、TC69（統計的方法）及びTC145（図記号）のいわゆる「ISO水平TC¹」とTC24（粉体）、TC108/SC4（機械振動の人体影響）、TC112（真空技術）、TC201（表面化学分析）、TC202（マイクロビーム分析）及びCIE（国際照明委員会）の「基礎的・基盤的TC」の合計42TC/SC（10TC及び32SC）である。

このうち我が国は7つの幹事国（1TC+6SC）を務めており、これは本技術分野の全幹事国数42の約20%を占めていることになる。これによって我が国は国際提案が容易となる状況等にあり、例年多数の新規提案を行っているが今後とも一層国際標準化を推進することとする。

(2) 最近の動向

基本技術分野の個別TCは、「水平TC」と「基礎的・基盤的TC」に分けられ、その最近の動向は下記のとおりである。

(2.1) 水平TC

①TC10（製図）は1947年にISO本部が設立されたとき、同時に設置されたISO最古のTCの一つ。現在130規格が制定されているが、寸法公差等はISO/TC213（製品の寸法等のGPS）に移行するなどした。また、2006年2月に我が国から提案した「ゲルインクペン」2件は、平成21年1月に国際規格として承認された。

②TC12（量・単位記号）の主要課題は「ISO80000シリーズ」の量記号・単位記号規格を完成することである。TC12は、ここ数年国際会議を開催せず、書面審議によってISO31（量及び単位）シリーズ14規格を、IEC/TC25との協調の下、「ISO80000シリーズ」への移行投票を行っているところである。現在、新分野の追加も含め、引き続き80000シリーズの整備が進められている。

③TC37（用語）において、我が国から「規格における用語のエントリー 第2部：国際用語規格の導入」（ISO10241-2）を国際提案中であり、現在DIS段階にある。ISO/SCは用語等のデータベースについて検討中であり、当TCの動向については、継続して把握しておく必要がある。

また、2007年12月に²VIM（国際計量用語集）第3版がISO/IEC Guide99として発行され、さらに2008年9月にGUM（測定における不確かさの表現ガイド）がISO/IEC Guide98-3として発行されたので、TC12及びTC69とも連携をとりつつ用語の整合化を図る必要がある。

¹ISO水平TCは、7TC(The Seven)とREMCO・CASCOの9委員会を指す。当基本技術専門委員会 は、このうち6TCを担当している。

²VIM：International Vocabulary of Metrology—Basic and general concepts and associated terms

- ④TC43(音響)は190規格をもつ大きなTCであるため、TC/SC幹事国への過度な業務集中を避け、規格品質を保つためTC全体のNWIP等の進行中の業務件数を最大40件までに自主制限している。これらの規格の中にはウィーン協定によって作成された規格も多数あり、EU主導で原案作成が行われた経緯もあることからEUの強制法規等に一部が引用されているものもある。我が国からは1件(プリンター等のOA機器からの騒音測定方法)を国際提案中(DIS段階)である。
- ⑤TC69(統計的方法の適用)には5つのSCがあるが我が国はこのうちの1つ(SC6測定方法及び測定結果)の議長・幹事国を務めており、2009年初めにNWIPを2件提出する予定である。さらに、我が国から新規SC(設計品質改善技法(田口メソッドを含む)設立の提案書を準備している。
- ⑥TC145(図記号)は、2006年「ISO/IEC業務指針」のISOサプリメントSQ³が改正され、TC145のホリゾンタルTCとしての役割が明確で重要なTC。TC145には、SC1(案内用図記号)、SC2(安全認識、標識、図形、記号、色及び文字)、SC3(器機・装置用図記号)の3つのSCが設置され、それぞれの図記号が検討されるほか、ISO全体の図記号の登録、デザインの統一等の役割を担っている。また、TC145(図記号)では、我が国から提案した「津波」に関する3件の図記号が含まれた国際規格が2008年7月に発行された。

(2.2) 基礎的・基盤的TC

- ①TC24(粉体)は、従来は「網ふるい」などによる「ふるい分け」がメインテーマであったが、これらの業務はほぼ終了し、現在は「ふるい分け」以外の方法のSC4(粒子特性評価)の国際標準化が活発である。TC24は2007年に開催した総会での発議に基づき2008年に名称を「粒子特性評価及びふるい」と変更し、従来のSC1、SC3、SC7を統合してSC8(試験用ふるい及び工業用ふるい)となり、SC4(粒子特性評価)と合わせて2つのSC体制となった。SC4には15のWGがあり我が国はWG8(画像解析法)とWG9(単一粒子光散乱法)の2つのWGのコンビナーと、WG2、6、11、12、14の5つのWGのシャドーコンビナー⁴を務めている。
- ②TC108(機械振動)は5つのSCとTC直下に多数のWGをもつ大きなTCであり、現在130規格がある。このうち基本技術専門委員会は「人体影響」(TC108/SC4)を担当している。このSCには8つのWGがある。2007年度からISO10068(駆動点における人の上腕のインピーダンス)等の改正に必要となるデータ収集等を、米国NIOSH(国立労働安全衛生研究所)との共同で実施している。

³ ISOサプリメントSQは、ISO/IEC Directivesの一部を構成し、ISOに固有のルールを規定している。2006年9月の改正において、「①各TC/SCはCD段階(遅くともDIS段階)までにTC145の当該WG1ウェブサイトへ申請し、②TC145は、「デザイン原則」及び他の図記号との重複等の問題がなければ登録する。」ことを規定した。

⁴ シャドーコンビナーはTC24/SC4固有のルールで、コンビナーが会議に欠席しても会議を開催できるように前もって指名されたエキスパート。コンビナーの通常業務を補助する場合もある。

- ③ TC 112 (真空技術)は、2006年に組織の見直しがあり、3WGで規格開発を行っている。我が国は、その内、WG 3 (真空部品)のコンビナーを獲得し、ドイツのコンビナーの引退により空席となっているWG 1 (真空ポンプ)についても実質的なコンビナーを務めている。
- ④ TC 201 (表面化学分析)は、「表面化学分析の分野、特に用語、一般的手順、データ管理及び取扱い、深さ方向の分析、オージェ電子分光法、二次イオン質量分析法、X線光電子分光法、グロー放電分光法、走査型プローブ顕微鏡法、全反射蛍光X線分光法」における国際標準化を目的としており、TCに9つのSCが設置され、我が国はTC 201の議長・幹事並びにSC 4 (深さ方向の分析)、SC 6 (二次イオン質量分析法)及びSC 8 (グロー放電分光法)の議長・幹事を務めている。また、TC 201は、その設立時、VAMAS (新材料と標準に関するベルサイユサミットプロジェクト)から設立支援を受けたこともあり、VAMASの「プレ標準化活動」の成果のうち20件をISO規格として作成している。TC 202 (マイクロビーム分析)は「マイクロビーム分析の分野、特に用語、一般的手順、電子線マイクロプローブ分析装置、分析電子顕微鏡、走査電子顕微鏡についての分析法」における国際標準化を目的としており、TCに4つのSCが設置され我が国はこのうちSC 3 (分析電子顕微鏡法)やSC 4 (走査型電子顕微鏡)の議長・幹事を務めている。
- ⑤ CIE (国際照明委員会)は、ISOとの協定 (ISO理事会決議 42/1999)によって、CIE規格はISOのDIS (FDIS)として登録できる。そのため、CIEはISOにとってTCとしての機能を有する。現在審議中の案件は、13件あり、その中で「TC 6-57 青色光網膜傷害および網膜の熱的傷害の作用スペクトルと関連用語の標準化」は、我が国がTCの委員長を行っている。-

2. 重点TCの国際標準化戦略

(1) ISO/TC 24 (粉体)

TC 24 / SC 4では固体の粒子径分布を種々の測定方法によって計測するほか、超微粒子分野 ($\mu\text{m}\sim\text{nm}$ の粒子のサイズ)、液体中の粒子径分布や分散度の測定の必要性が高まっている。また、粒子径分布については種々の物理的、電気的方法によって計測するため、標準物質として、「標準微粒子」の標準化の必要性もたかまっていることから、これらの分野へ我が国から積極的な対応を予定している。

再編後のSC 8では、ふるい関係の既存の規格を直して新しい規格も作ろうという動きも出ており注視している。

(2) ISO/TC 69 (統計的方法の適用)

2008年10月に開催されたTC 69総会において、我が国から提案している実用的統計手法の新規SCの実用的統計手法の作業範囲と具体的な審議項目を検討するためのワークショップを開催した。今後、ワークショップの結果を踏まえてSC設立提案書を修正し、TC 69内で投票が実施される。SC設立が決まった場合には、議長・幹事

国を獲得し委員会の運営を担うことになる。また我が国で既に議長・幹事国を務めているSC6では、ISOの主要な統計的方法の一つとなっているISO5725(測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度))シリーズの改正作業及びISO11843(測定方法の検出能力)シリーズの新規提案などで、今後とも我が国が主導的役割を果たすよう務めている。

(3) ISO/TC112(真空技術)

ISO/TC112は他の多くのTCと同様に欧州中心に国際標準化が行われてきたが、現在議論されている項目は提案予定の項目も含め7件で、その内で韓国が3件、日本が1件、中国が1件とアジア地域の寄与が高くなっている。韓国との協力関係を積極的に進めており、韓国提案項目の技術的支援を行っている。提案予定の1件(残留ガス分析計の仕様)は共同提案になる予定である。我が国からの提案は「真空ポンプの安全使用に係る規格化」であり、ターボ分子ポンプの製造業者の世界市場に占める日本の割合はほぼ過半数に達していることなどから積極的に提案したものである。

(4) ISO/TC145(図記号)

図記号は、公共機関等に広く用いられるため、既に我が国に普及しつつある図記号が国際規格に採択されない場合、その影響力は非常に大きい。

また、2008年度から基準認証研究開発事業「外国人観光客等に向けた国際提案図記号の調査及び作成」によって、我が国の公共施設等で用いられている案内用図記号等について諸外国とラウンドロビンを(RRT)を行い、年間数件ずつ、国際提案していく予定である。

(5) ISO/TC201(表面化学分析)・TC202(マイクロビーム分析)

TC201及び202においては、我が国はTC201の幹事国・議長及び5SCの幹事国等を務めており、国際提案が容易に行える条件下にあるが、当該分野は研究開発と密接な関係にあるため標準化に係る研究開発費等の支援が必要である。

3. 重点TCの活動状況

(1) 対象としているTC番号及び名称

- ① ISO/TC24(粉体)
- ② ISO/TC69(統計的方法の適用)
- ③ ISOTC112(真空技術)
- ④ ISO/TC145(図記号)
- ⑤ ISO/TC201(表面化学分析)・TC202(マイクロビーム分析)

(2) 対象としているTCの最近の動向(規格化方針・運営方針等)

① I S O / T C 2 4 (粉体)

T C 2 4 (粉体) の名称は、本年度から「粒子特性評価及びふるい」と変更され、従来の S C 1、S C 3、S C 7 を統合して S C 8 (試験用ふるい及び工業用ふるい) となり、S C 4 (粒子特性評価) と合わせて、新体制となった。

② I S O / T C 6 9 (統計的方法の適用)

I S O / T C 6 9 は、I S O 理事会決議 (12/1959 及び 26/1961) によって I S O の全ての T C に対し「標準化における統計的手法の適用」に関するアドバイザー機能をもつ重要なホリゾンタル T C である。

2009 年は、日本から提案している実用的統計手法に関する新規 S C の具体的な審議項目を検討するワークショップが T C 6 9 総会において開催され、新 S C 設置の提案書を修正したうえで T C 6 9 内での投票を実施することが決議されたところである。

③ I S O T C 1 1 2 (真空技術)

真空技術の最大のユーザは、半導体産業である。真空産業の世界的規模は約 100 社、約 4, 190 百万 \$ (2006 年) と、比較的小規模産業であるが、真空技術は、先端分野の基礎的・基盤的な技術であるほか種々の真空度によって多方面の産業分野で用いられている (半導体産業等の大規模な精密加工産業等に不可欠な技術であるほか魔法びん、冷凍食品のような生活用品にまで)。

全世界の真空産業 (2006 年) (TC112 ビジネスプラン)		
分 野	百万ドル	割合 (%)
半導体プロセス用	1, 680	40
産業用	500	12
一般プロセス用	460	11
装置機器用	290	7
薄膜 (半導体以外) 用	420	10
その他	840	20
合 計	4, 190	100

低真空	プロセス真空	工業真空	半導体真空	薄膜真空	機器真空	R&D 真空
圧力 (Pa)						
$>10^2$	>1	$1-10^{-4}$	10^2-10^{-6}	$10^{-1}-10^{-6}$	$10^{-4}-10^{-8}$	$1-10^{-9}$

包装	化学	冶金	シリコン	DVD	質量分析	大学
印刷	医薬品	熱処理	TFT	FED	漏れ検出	研究所
医療	食品	レーザ	CVD	薄膜	表面分析	宇宙実験
	飲料	TV受像管	MEMS	光学被膜	イオンビーム	
	繊維・紙	蛍光灯				
	セラミックス	エアコン				
	ガラス・ドライ	まほうびん				

ISO/TC112は他の多くのTCと同様に欧州中心に国際標準化が行われてきたが、現在議論されている項目は提案予定の項目も含め7件で、その内で韓国が3件、日本が1件、中国が1件とアジア地域の寄与が高くなっている。韓国との協力関係を積極的に進めており、韓国提案項目の技術的支援を行っている。提案予定の1件（残留ガス分析計の仕様）は共同提案になる予定である。我が国からの提案は、「真空ポンプの安全使用に係る規格化」であり、ターボ分子ポンプの製造業者の世界市場に占める日本の割合はほぼ過半数に達していることなどから積極的に提案したものである。

また、我が国は、2006年からTC112の組織再編に伴い、WG3のコンビナーに就任しており、ドイツのコンビナーの引退により空席となっているWG1についても実質的なコンビナーをつとめている（TC本体及びWG2はドイツが幹事国/コンビナー）。今後も、コンビナーとしての地位を最大限活用し、国際標準化をより一層推進するため、新規提案等への国の支援策等を検討する必要がある。

④ ISO/TC145 (図記号)

2006年「ISO/IEC業務指針」のISOサプリメントSQが改正され、TC145のホリゾンタルTCとしての役割が明確になった。今後TC145は、ISO全体の図記号の登録、デザインの統一等の役割を担うほか、従来どおり図記号の新規制定等を行う。

我が国が2005年に提案した「津波」に関する3件の図記号は、2008年に国際規格として発行されたとなった。

今後は、これらの経験を踏まえ、我が国で広く利用されている案内用図記号等のうち、国際提案が有望な図記号については「ラウンドロビンテスト（RRT）を用いた国際提案図記号の作成調査研究」を実施し、毎年数件の国際提案を行うべく事業を開始することとしたところである。

⑤ ISO/TC201 (表面化学分析)・TC202 (マイクロビーム分析)

両TCは、1992年、同時期に設立され、相互にリエゾン関係を結び密接な関係にある。両TCは、「機器分析」のうち、我が国半導体産業の重要分野と位置づけ、関係の学会やユーザ、メーカーと共に、TC活動を行っている。

具体的には、TCに9つのSCが設置され、我が国はTC本体の議長・幹事並びにSC4、SC6及びSC8の議長・幹事を務めている。

TC202は、TCに4つのSCが設置されているが、我が国はこのうちの2つのS

Cの議長・幹事を務めている。

4. 我が国の活動実績(2008年)

(1) 全体概要

①TC10(製図)

2006年2月に我が国から提案した「ゲルインクペン」2件は、平成21年1月に国際規格として承認された。

②ISO/TC24(粉体)

SC4においては、我が国は国際会議、国内委員会とも活発に活動している。SC4総会は、2008年9月にストラットフォード・アポン・エイボン(英国)で開催され、我が国からは多数参加した。また、同時にSC8(試験用ふるい及び工業用ふるい)第1回会議も開催され、日本を含む5カ国が参加した。日本から2名が参加し、議長にドイツのHaver氏を選んで現状のISO規格について審議した。

国内対策委員会は、これらの国際会議前後に開催し、その対応とフォローアップ等を行った。

③ISO/TC69(統計的方法の適用)

2008年10月に北京(中国)で開催されたTC69総会で、我が国から提案した「田口メソッド」等の設計品質改善技法に関する新SCの具体的な審議項目を検討するためのワークショップを日本がコンビナーとなって開催し、賛同を求めた。

SC4においては、新規作業項目のプロジェクトリーダーを要請され、引き受けることとなった。

また、SC6においては、2009年初めに日本から提案する予定のNWIP2件についてメンバーの賛同を求めるための説明を行い、投票にかけることがSC6において決議されたので、それぞれの原案を準備中である。

④ISOTC112(真空技術)

TC総会は2008年9月にWG1、WG2、WG3の委員会とともに東京で開催した。これまでで最多の9カ国から総勢32名(ドイツ5名、スイス2名、スペイン1名、フランス1名、英国1名、米国2名、中国3名、韓国4名、日本13名)の参加があり活発な討議が行われ、日本提案の「真空ポンプの安全使用に係る規格化」はDISに進んだ。

⑤ISO/TC145(図記号)

TC145総会及びSC1は2008年5月にシカゴ(米国)で、SC3は同年4月に東京(日本)で国際会議が開催された。SC2においては、2008年6月ピサ(イタリア)で国際会議が開催され色座標の範囲等の審議を行った。

また、2009年3月にミュンヘン(ドイツ)で国際会議開催が予定されている。

さらに2008年12月には「避難経路図」のFDISの投票が行われた。我が国から提案した「津波図記号」は2008年7月に国際規格とされた。

⑥ISO/TC201(表面化学分析)・TC202(マイクロビーム分析)

(TC201)

TC201総会は、2008年9月にスイス（ヴヴェイ）で開催された。13ヶ国66名の参加があり、活発な討議が行われた。ISO/TC201/SC9/WG1については総会前日に会議が行われ、審議された内容を9月20日の総会にて報告された。活動分野については、その将来動向を定めるためにスタディーグループを立ち上げることとなった。

(TC202)

TC202総会は、2008年9月にフランスで開催された。10ヶ国から44名の参加があり、我が国からは、SC議長・幹事等、合計10名が参加。SC2（電子線マイクロプローブ分析装置）において我が国から新規提案した「EPMAにおける面分析法」のWDの中身説明、討議。SC3（分析電子顕微鏡）、SC4（走査電子顕微鏡）において、それぞれ我が国から提案した「TEM倍率校正法」および「SEMにおける像分解能測定方法」の要点及び進捗状況について説明、討議。次年度の新規提案としてSC1（ターミノロジー）において「TEMターミノロジー」をNWIPすべく準備している旨、報告された。

(2) 活動実績

(2.1) ISO/TC24 (粉体)

① 新規提案数：2008年 3件

② 国際会議実績

2008年9月 SC4総会 ストラットフォード・アポン・エイボン（英国）9名

2009年3月 SC4総会 ベルン（スイス）10名

③ 幹事国・議長・コンビナー等引受実績

SC4/WG8（画像解析法） コンビナー

SC4/WG9（単一粒子光散乱法） コンビナー

④ その他の活動実績

特になし。

⑤ 活動実績の評価

国際規格作成においては、従来から取り組んできた粉体計測方法関係はその多くが審議をほぼ終えてISO規格になったもの、その直前のものである。

今後は、標準物質としての「標準微粒子」や、ナノ粒子を含む極微小粒子の測定方法、コンタミネーション等の分野の国際標準化を進める予定である。

(2.2) ISO/TC69 (統計的方法の適用)

① 新規提案数：2008年 0件

② 国際会議実績

2008年10月 TC69総会 北京（中国） 10名

③ 幹事国・議長・コンビナー等引受実績

特になし。

④ その他の活動実績 {実績に基づく修正案}

SC4において、プロジェクトリーダーを1件引き受けることとなった。また、SC6において日本から提案する2件のプロジェクトについてもそれぞれプロジェクトリーダーを引受ける予定。また、日本から設置提案を行っている新SCのNWIPについても素案を検討中である。

⑤ 活動実績の評価

日本からの新SCの提案については、昨年設置されたアドホックグループの主催のワークショップを実施し、各国に賛同を求めた。この結果、新SC設置提案書を修正し、TC69内の投票にかけることが決議され、進展があった。

各SCの活動についても、国際会議では積極的に各委員が発言し、プロジェクトリーダーの引受けなども行っている。

(2.3) ISOTC112 (真空技術)

① 新規提案数：2008年 0件

② 国際会議実績

2008年9月 TC112総会、WG1, 2, 3委員会 東京 13名

③ 幹事国・議長・コンビナー等引受実績

WG1 (真空ポンプ)のコンビナー代理 (ドイツから後任が見つかるまで) を引き受けた。

④ その他の活動実績

我が国は議長・幹事国であるドイツに出張し、その際には韓国、スイスの参加を要請し、実質的にはTC112の主な参加者による会議をもち今後の運営等を議論した。また、WD/TS27893 (ドイツ提案)、WD27894 (韓国提案) のドラフト作成などに協力した。

⑤ 活動実績の評価

WG1 (真空ポンプ)のコンビナー代理が依頼されるなど、我が国の精力的な活動が評価されている。韓国との協力関係も進んでいる。今後も国際会議出席を積極的に進める必要がある。

(2.4) ISO/TC145 (図記号)

① 新規提案数：2008年0件

② 国際会議実績

2008年4月 東京 10名

2008年5月 シカゴ 6名

2009年3月 ミュウヘン 2名

③ 幹事国・議長・コンビナー等引受実績

特になし。

④ その他の活動実績

ISO/TC 145/SC 3/TF 2 リーダー

⑤ 活動実績の評価

我が国の意見を反映させるため、一層の国際会議出席者の質的・量的強化を図る必要がある。

(2.5) ISO/TC 201 (表面化学分析)・TC 202 (マイクロビーム分析)

(TC 201)

① 新規提案数：2008年3件

② 国際会議実績

2008年9月 TC 201 総会がヴヴェイ（スイス）で開催され我が国から33名が出席。

③ 幹事国・議長・コンビナー等引受実績

なし。

④ その他の活動実績

なし。

⑤ 活動実績の評価

TCの議長・幹事国として我が国はより一層イニシアチブをとっていくことが必要である。

(TC 202)

① 新規提案数：2008年0件

② 国際会議実績

2008年9月にISO/TC202(マイクロビーム分析)国際会議がパリ（フランス）で開催され、我が国から10名が出席。

③ 幹事国・議長・コンビナー等引受実績

無し。

④ その他の活動実績

特になし。

⑤ 活動実績の評価

2008年9月に開催された国際会議で、我が国から新規提案した「EPMAにおける面分析法」のWDの中身説明、討議。またSC3(分析電子顕微鏡)、SC4(走査電子顕微鏡)においても、我が国から提案した「TEM倍率校正法」及び「SEMにおける像分解能測定方法」の要点並び進捗状況について説明、討議。次年度の新規提案としてSC1(ターミノロジー)において「TEMターミノロジー」をNWIPすべく準備している旨、報告を行った。

5. 我が国の活動計画(2009年)

(1) 全体概要

① I S O / T C 2 4 (粉体)

国際規格作成においては、従来から取り組んできた粉体計測方法関係はその多くが審議をほぼ終えて I S O 規格になったもの、その直前のものである。

今後は、標準物質としての「標準微粒子」や、ナノ粒子を含む極微小粒子の測定方法、コンタミネーション等の分野の国際標準化を進める予定である。

S C 4 会議は 2 0 0 9 年 3 月ベルン（スイス）で開催がされた。

② I S O / T C 6 9 (統計的方法の適用)

2 0 0 8 年 1 0 月の北京会議において日本がコンビナとして開催したワークショップの結果を受けて、設計品質改善技法に関する新 S C 設置の投票が T C 6 9 内で開始される。その結果採用された場合には、次回会議で初の S C 会議、W G 会議を運営する。また、S C 6 W G 5 においては、日本提案の N W I P 2 件の検討を行う。

なお、次回 T C 6 9 総会は、2 0 0 9 年 6 月マレーシア（クアラルンプール）で開催予定である。

③ I S O T C 1 1 2 (真空技術)

我が国から提案した「真空ポンプの安全使用に係る規格化」については、東京総会で寄せられたコメント（「破壊時の発生トルクの測定法」など）についての議論がなされ、修正された。会議終了後 2008/9/18 が締め切りの投票の結果、コメント付き賛成が 5 カ国（日、独、英、米、韓）、賛成が 3 カ国（中、露、スペイン）、棄権が 1 カ国（スイス）であった。コメント内容を検討し、次段階 D I S に進むことになった。

また、2 0 0 8 年 9 月の東京総会で新規提案すべき案件が整理され、真空関係の用語についてなどの改訂提案の準備が進められる事となった。

次回 T C 1 1 2 総会は、2 0 0 9 年 9 月頃、中国で開催予定である。

④ I S O / T C 1 4 5 (図記号)

S C 1 については、I S O 7 0 0 1 (案内用図記号)の D I S 投票等に積極的に対応する。また、2 0 0 7 年 1 2 月に I S O 3 8 6 4 - 1 (安全標識に用いる色、デザイン通則)の定期見直しにおいて、我が国から提案した「色」について積極的に審議を進めていく。S C 3 については 2 千件以上の図記号をもつ I S O 7 0 0 0 (装置用図記号)の分類作業のうち日本分担の約 7 0 0 件の分類作業を完成させる予定である。

⑤ I S O / T C 2 0 1 (表面化学分析)・T C 2 0 2 (マイクロビーム分析)

T C 2 0 1 においては、各 S C のうち、特に S C 6 (S I M S) について、基準認証研究開発事業(有機薄膜の高精度組成分析)を通じて国際標準化を強力に推進する。

(2) 活動計画

(2.1) I S O / T C 2 4 (粉体)

① 新規提案予定件数： 0 件

② 幹事国等引受予定件数： 0 件

(2.2) I S O / T C 6 9 (統計的方法の適用)

- ① 新規提案予定件数： 2件(新規S Cが設立された場合)約1-4件
- ② 幹事国等引受予定件数： 0件(新規S Cが設立された場合 議長・幹事国1件)

(2.3) I S O T C 1 1 2 (真空技術)

- ① 新規提案予定件数： 1件(韓国との協同)
- ② 幹事国等引受予定件数： 0件
(2008年にドイツがTC幹事国を終了する可能性がある。2004年には我が国は幹事国引受を辞退した経緯がある。)

(2.4) I S O / T C 1 4 5 (図記号)

- ① 新規提案予定件数： 0件
- ② 幹事国等引受予定件数： 0件

(2.5) I S O / T C 2 0 1 (表面化学分析)・T C 2 0 2 (マイクロビーム分析)

- ① 新規提案予定件数： 2件(TC201 1件、TC202 1件)
- ② 幹事国等引受予定件数： 0

6. 参考資料集

(1) 基本技術分野のISO/TC/SC及びWGの活動状況及び重点分野

TC 番号	SC 番号	WG 番号	名称	参加 地位	国内審議団体	幹事国	日本 議長	日本 主査	重点 分野
10			製図	P	(社)日本機械学会	スウェーデン	—	—	—
		16	3Dモデル	—		アメリカ	—	—	
		17	用語の定義	—		スウェーデン	—	—	
		18	製図筆記具	P		日本	—	○	
	1		一般原則	P		ルウエー	—	—	—
		6	文書管理	P		スウェーデン	—	—	
	10		製図用図記号(tpd)	P		ドイツ	—	—	—
		6	溶接、表面粗さ等の図記号	—		スウェーデン	—	—	
		7	材料、加工用等の図記号	—		スウェーデン	—	—	
		9	ダイヤグラム	P		スウェーデン	—	—	
		10	参照表示システム	P		ドイツ	—	—	
	11	ISO10628の改正	P	ドイツ	—	—			
12			量記号・単位記号	P	(財)日本規格協会	スウェーデン	—	—	—
		1	調和	P		スウェーデン	—	—	
		2	図表における量の値	P		スウェーデン	—	—	
		3	音響	P		スウェーデン	—	—	
		4	空間及び時間	P		スウェーデン	—	—	
		5	力学	P		スウェーデン	—	—	
		6	小数記号	P		スウェーデン	—	—	
		7	熱力学	P		スウェーデン	—	—	
		8	電磁気学	P		スウェーデン	—	—	
		9	光学	P		スウェーデン	—	—	
		10	物理化学・原子物理学	P		スウェーデン	—	—	
		11	数学記号	P		スウェーデン	—	—	
		12	情報技術	P		スウェーデン	—	—	
13	バイオメトリックス	P	スウェーデン	—	—				
19		標準数(スタンバイ)	—	(財)日本規格協会	フランス	—	—	—	
24	4		粒子特性評価及びふるい	P	(社)日本粉体工業 技術協会	ドイツ	—	—	◎
			ふるい分け以外の粒度測定	P		アメリカ	—	—	
		1	測定結果の表示	P		ドイツ	—	—	
		2	沈降法	P		日本	—	—	
		3	比表面積・細孔・気孔率	P		アメリカ	—	—	
		5	電気的検知帯法	P		英国	—	—	
		6	レーザ回折法	P		アメリカ	—	—	
		7	動的光散乱法	P		ベルギー	—	—	
		8	画像解析法	P/S		日本	—	○	
		9	単一粒子光散乱法	P/S		日本	—	○	
		10	X線小角散乱法	P		未定	—	—	
		11	試料調整及び試験用粒子	P		フィンランド	—	—	
		12	電気移動度法	P		アメリカ	—	—	
		14	音響法	P		アメリカ	—	—	
		15	光収束技術	P		アメリカ	—	—	
		16	液分散系の粒子特性評価	P		ドイツ	—	—	
		17	表面電位の測定	P		アメリカ	—	—	
	8		試験用ふるい及び工業用ふるい	P	ドイツ	—	—		

TC 番号	SC 番号	WG 番号	名称	参加 地位	国内審議団体	幹事国	日本 議長	日本 主査	重点 分野			
37	1		用語	P	(財)日本規格協会	オーストリア	—	—	—			
			用語の原則	P		スウェーデン	—	—				
		2	用語の調和	P		メキシコ	—	—				
		3	原則、方法及び用語集	P		カナダ	—	—				
		4	社会用語	P		カナダ	—	—				
	2	5	概念のモデル化	P		ベルギー	—	—				
			用語編集及び辞書編集	P		カナダ	—	—				
		1	言語符号化	P		スイス	—	—				
		2	専門用語編集	P		スイス	—	—				
		3	辞書編集	P		ドイツ	—	—				
		4	言語資源出所の識別	P		イギリス	—	—				
	3	5	多様性確保のための証明スキーム	P		イギリス	—	—				
		6	翻訳サービス	P		カナダ	—	—				
			用語のコンピュータ応用	P		ドイツ	—	—				
		1	データ要素	P		アメリカ	—	—				
	4	2	用語集	P		ドイツ	—	—				
		3	データ変換	P		アメリカ	—	—				
		4	用語データベース管理	P		デンマーク	—	—				
			言語資源管理	P		韓国	—	—				
	43			音響		P	(社)日本音響学会	デンマーク		—	—	—
			1	聴覚閾値		P		スイス		—	—	
			8	自由音場環境試験方法		P		イギリス		—	—	
			9	ラウドネスレベル計算方法		P		アメリカ		—	—	
		1		騒音		P		デンマーク		—	—	
			17	聴覚保護具の遮音性能		P		デンマーク		—	—	
22			固体音発生源	P	ドイツ	—		—				
23			事務・通信機器等の騒音	P	日本	—		○				
27			乗り物の騒音への温度影響	P	スウェーデン	—		—				
28			機械騒音の放射	P	アメリカ	—		—				
31			弾性素子の音響伝達特性	P	オランダ	—		—				
33	路面の交通騒音		P	スウェーデン	—	—						
38	路面の吸音特性		P	オランダ	—	—						
39	舗装路面の肌理の特徴付け	P	スウェーデン	—	—							
40	衝撃音の伝搬特性	P	アメリカ	—	—							
42	道路車両の放射騒音	P	アメリカ	—	—							
45	環境騒音の測定	P	アメリカ	—	—							
51	射撃場の騒音測定	P	ドイツ	—	—							
52	空港騒音の連続監視	P	ドイツ	—	—							
53	作業環境の騒音暴露	P	ルウエー	—	—							

TC 番号	SC 番号	WG 番号	名称	参加 地位	国内審議団体	幹事国	日本 議長	日本 主査	重点 分野	
69			統計的方法の適用	P	(財)日本規格協会	フランス	—	—	◎	
		3	データの統計的解釈方法	P		フランス	—	—		
		9	乱数発生法	P		日本	—	○		
		1		用語・記号		P	アメリカ	—		—
			2	ISO3534の改正		P	イギリス	—		—
		4		工程管理		P	アメリカ	—		—
			6	工程能力・パフォーマンスの計量		P	イギリス	—		—
			9	能力を計量する統計量		P	ドイツ	—		—
			10	管理図に関するISO改正		P	アメリカ	—		—
			11	工程能力・パフォーマンス		P	デンマーク	—		—
			12	SPCの実践		P	アメリカ	—		—
		5		合否判定抜取検査		P	イギリス	—		—
			1	サンプリング問題の分類		P	アメリカ	—		—
			2	ISO2859の改正		P	アメリカ	—		—
			3	ISO3951の改正		P	イギリス	—		—
			4	逐次及び連続抜取方式		P	パキスタン	—		—
			5	PPMオーダーの抜取方式		P	アメリカ	—		—
			6	Ac=0の抜取検査方式		P	アメリカ	—		—
		6		測定方法及び測定結果		S	日本	○		—
			1	ISO5725の改正		P	フランス	—		—
			5	検出能力		P	日本	—		○
			7	不確かさの評価		P	イギリス	—		—
		7		シックスシグマに必要な技法の適用		P	中国／ 英国	—		—
			1	実験計画法		P	フランス	—		—
			2	工程計測と測定能力		P	中国	—		—
			3	シックスシグマの手法		P	英国	—		—
		108	4			機械振動の人体への影響	P	(社)日本機械学会		ドイツ
3	手動振動			P	ドイツ	—	—			
5	生体モデル			P	カナダ	—	—			
8	振動感覚			P	カナダ	—	—			
9	鉄道振動			P	日本	—	○			
12	ISO10819の改正			P	アメリカ	—	—			
14	全身振動			P	アメリカ	—	—			
112			真空技術	P	日本真空協会	ドイツ	—	—	◎	
		1	真空ポンプ	P		ドイツ	—	—		
		2	真空計器	P		ドイツ	—	—		
		3	真空装置	P		日本	—	○		
145			図記号	P	(財)日本規格協会	イギリス	—	—	◎	
		3	用語	P		イギリス	—	—		
		6	テストデータの評価	P		アメリカ	—	—		
		JWG 11	IECとの協調	P		日本	—	○		
		1		案内用図記号		P	イギリス	—		—
			1	評価とテスト		P	イギリス	—		—
	2		視覚とデザイン基準	P	オランダ	—	—			
	4		ISO7001の改正	P	イギリス	—	—			
	2		安全用図記号	P	(社)日本保安用品 協会	ドイツ	—	—		
		1	図形、記号及び色	—		ドイツ	—	—		
		2	標識、看板及びラベル	—		イギリス	—	—		
		3	安全誘導システム	—		ドイツ	—	—		
	3		装置用図記号	P	(財)日本規格協会	イギリス	—	—		
1		調整と登録	P	アメリカ		—	—			
2		ISO7000の改正	P	アメリカ		—	—			

TC 番号	SC 番号	WG 番号	名称	参加 地位	国内審議団体	幹事国	日本 議長	日本 主査	重点 分野
201	1	2	表面化学分析	P/S	(財)日本規格協会	日本	○	—	◎
		2	全反射蛍光X線分析	P		日本	—	○	
	2	1	用語	P		アメリカ	—	—	
		2	用語の定義	P		イギリス	—	—	
	2		一般的手順	P		アメリカ	—	—	
		1	試料処理	P		アメリカ	—	—	
		2	標準物質	P		ドイツ	—	—	
	3	3	結果の報告	P		イギリス	—	—	
			データ管理	P		イギリス	—	—	
		1	データ変換	P		イギリス	—	—	
	4	4	AESとXPSのピーク検出	P/S		日本	—	○	
			深さ方向の分析	P/S		日本	○	—	
		1	定義と手法	P/S		日本	—	○	
	5	2	標準物質	P		韓国	—	—	
			オージェ電子分光(AES)	P		アメリカ	—	—	
	6	1	定量方法	P		アメリカ	—	—	
			イオン質量分析(SIMS)	P/S		日本	○	—	
	7	3	SIMSの深さ分析	P		韓国	—	—	
		4	スタティックSIMS	P		イギリス	—	—	
			X線光電子分光(XPS)	P		イギリス	—	—	
	8	1	機器操作	P		イギリス	—	—	
2		エネルギー強度補正	P	イギリス	—	—			
		グロー放電分析(GDS)	S	日本	—	—			
9	1	コーティングの分析	P	スウェーデン	—	—			
	2	使用方法	P	オーストリア	—	—			
	3	酸化金属の分析	P	スウェーデン	—	—			
202	9	走査プローブ電子顕微鏡	P	韓国	—	—			
		マイクロビーム分析	P	中国	—	—			
	1	データマネジメント	P	イギリス	—	—			
	6	後方散乱分析ガイドライン	P	中国	—	—			
	1	用語	P	アメリカ	—	—			
	2	電子プローブ電子顕微鏡	P	中国	—	—			
	6	定量分析	P	日本	—	○			
3	分析電子顕微鏡(AFM)	P/S	日本	○	—				
CIE	4	走査電子顕微鏡(SEM)	P/S	日本	○	—			
		国際照明委員会	P	(社)日本照明委員会	—	—	—		

注1)◎印がついているのが重点分野
注2)日本議長、主査には○印

基本技術分野計

TC 数	SC 数	WG 数	幹事	議長	主査	
10	32	132	日本引き受け数	16	6	13

(2)2008年活動実績データ

①提案規格数 新規4件

TC	SC	WG	規格名称	新規・改正 の別
201	6		表面化学分析—二次イオン質量分析法—シリコン中ヒ素の深さ方向分析方法	
201	9		Surface chemical analysis -Procedure for in situ characterization of AFM probes used for nanostructure measurement	
201	9		Surface chemical analysis - scanned probe microscopy - Guide to describe AFM probe properties	
202	2		EPMA面分析定量化法	

②国際会議実績

a)参加実績 (TC/SCLレベル 12回延べ 102人)

b)日本での開催実績 2008年9月に東京でTC112(真空技術)が開催、9ヶ国から総勢32名が参加。

